

УДК 004.052.32, 620.199

Испытания электронной компонентной базы на сохраняемость

И. Ю. Булаев¹, А. С. Чистов², А. Ю. Штукарёв³

^{1,3}инженер-исследователь 1 кат., НЦ СЭО ОАО «Российские космические системы»

²инженер-исследователь 2 кат., НЦ СЭО ОАО «Российские космические системы»

e-mail: ¹bulaev.ivan@gmail.com

Аннотация. Доклад раскрывает проблемы проведения испытаний на сохраняемость изделий электронной компонентной базы. Авторами предложен новый метод проведения испытаний на сохраняемость изделий электронной компонентной базы.

Ключевые слова: электронная компонентная база, сохраняемость, ускоренное хранение, испытания на безотказность

Storageability Test of Electronic Components

I. Yu. Bulaev¹, A. S. Chistov², A. Yu. Shtukarev³

^{1,3}research engineer (1 cat.), Joint Stock Company "Russian Space Systems"

²research engineer (2 cat.), Joint Stock Company "Russian Space Systems"

e-mail: ¹bulaev.ivan@gmail.com

Abstract. Report reveals the problems of carrying out of storageability test of electronic components. The authors propose a new method of carrying out of storageability test of electronic components.

Key words: electronic components, storageability, accelerated storage, life-test